

半導体デバイス信頼性(摩耗故障・ソフトウェア)セミナー ～Foundry活用時代のシリコン信頼性について～

改版: EDR-4707 LSIの故障メカニズム及び試験方法に関する調査報告
EDR-4705A JEITAソフトウェア試験ガイドライン

主催・企画：一般社団法人 電子情報技術産業協会 半導体信頼性技術委員会

日本の企業は半導体Foundryを活用することが増えてきております。製品の信頼性を保証するためにはFoundryからの摩耗故障信頼性データを正しく理解することが重要です。また、近年 α 線や宇宙線起因中性子によるソフトウェアが信頼性を脅かす要因となっており、そのメカニズムや対策等についても理解することは車載を初めとする高信頼性用途では必須になってきました。JEITAは国内基準をJEDECやIEC基準に提案、基準化し日本が安心してFoundryを使えるための活動をおこなっています。専門家であるJEITA委員が摩耗故障およびソフトウェアのメカニズムと信頼性の考え方を解説致します。半導体の信頼性設計あるいは製品認定等で、Foundryを活用される立場の方々に有益な内容になっております。皆様のご参加を心よりお待ちしております。

日時

2018年 3月26日(月) 10:00～17:00

会場

大阪大学 中之島センター 講義室302

Program

司会:

故障メカニズム 松山英也 (株)ソシオネクスト)

ソフトウェア 若井伸之 (東芝デバイス&ストレージ(株))

	開催のご挨拶 半導体信頼性技術委員会
午前 10:00開始	概要説明 故障メカニズム (MOSFETの信頼性) [Hot carrier注入、NBTI (PBTI)、ゲート酸化膜の経時絶縁破壊]
	田中 宏幸 (ラピスセミコンダクタ(株))、細野 剛 (ローム(株)) 大日方浩二 (ソニー(株)) (質疑応答)
お昼休み	休憩の終わり、午後の開始前に名刺交換会を行います。
午後1 講義の間に短い休憩を入れます。	High-K. Metal-Gateの説明 故障メカニズム(配線の信頼性) [エレクトロマイグレーション、ストレスマイグレーション、層間膜の経時絶縁破壊]およびCPI Chip Package Interaction 茂野 洋一 (ルネサスエレクトロニクス(株))、高島 智 (新日本無線(株)) 松山 英也 (株)ソシオネクスト)、若井 伸之 (株)東芝) (質疑応答)
午後休憩	
午後2 15時頃 講義の間に短い休憩を入れます。	ソフトウェア [ソフトウェアのメカニズム、中性子、 α 線のデバイスへの影響] および、高エネルギー中性子によるパワーデバイスのバーンアウト (参考講義) 横関 弥樹博 (ソニー(株))、若井 伸之 ((株)東芝)、浅井 弘彰 (HIREC(株)) 松山 英也 (株)ソシオネクスト) (質疑応答)
	全体質疑応答
	閉会のご挨拶
	アンケート

半導体デバイス信頼性(摩耗故障・ソフトウェア)セミナー ～Foundry活用時代のシリコン信頼性について～

EDR-4707 LSIの故障メカニズム及び試験方法に関する調査報告
EDR-4705A JEITAソフトウェア試験ガイドライン

— 参加要領 —

■日 時 2018年3月26日(月) 10:00～17:00 (開場 9:30)

■場 所

大阪大学中之島センター 講義室 302
〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島4-3-53
TEL 06-6444-2100 (代表)
URL <https://www.onc.osaka-u.ac.jp/>



■申込期限 2018年3月19日(月) 必着

■定 員 40名
(定員になり次第締め切らせて頂きます)

■申込方法 参加のお申し込みは、
下記URLから申込書をダウンロードして下さい。
<http://semiconjeitassc.jeita-sdte.com/srg/>

■参加費 20,000円 (JEITA会員) 25,000円 (非会員) 3,000円 (学生) 税込
特別参加 ¥33,000 (聴講は2名まで可能 EDR-4705A, EDR-4707 1セットをお付けします。)

※会員・非会員の区分は、申込各位にてご確認ください。(特別参加の場合、区分不要)
(JEITA会員一覧) <http://www.jeita.or.jp/cgi-bin/member/list.cgi>
※お申込み後のキャンセルはお断りさせていただいております。
※セミナーにて解説する内容をまとめた資料を当日配布いたします。
※セミナー参加者向けの当該ガイドライン特別頒布価格を設定させていただいております。
まだお持ちでない方は冊子の入手をお勧めいたします。ただし、専用申込書(別紙)でのお申込みに限りますのでご留意願います。

規格・ガイドライン名	番号	セミナー参加特別頒布価格
JEITAソフトウェア試験ガイドライン	EDR-4705A	¥4,000
LSIの故障メカニズム及び試験方法に関する調査報告	EDR-4707	¥9,000

■お知らせ (今後の開催予定について)

当セミナーはお陰様を持ちまして大変好評を頂いております。
2018年度も各地での開催を予定しておりますので、皆様のご参加をお待ちしております。
開催詳細につきましては、ホームページ等で公開予定です。

■運営事務局・各種問合せ先

株式会社 ティアテック
JEITA信頼性セミナー運営事務局 担当: 佐久間
〒135-0034 東京都江東区永代2-16-1 ティアテックビル
TEL: 03-5875-9250 FAX: 03-5875-9251 E-mail: jeita@tiatech.com

■主 催 一般社団法人 電子情報技術産業協会 半導体信頼性技術委員会
〒100-0004 東京都千代田区大手町1-1-3 大手センタービル

※申し込み時に入力いただきました個人情報は本セミナーの受付、次回ご案内の為に使用いたします。
他の目的で使用することはありません。
※JEITAの個人情報保護方針につきましては下記をご参照ください。
<http://www.jeita.or.jp/japanese/privacy/>